

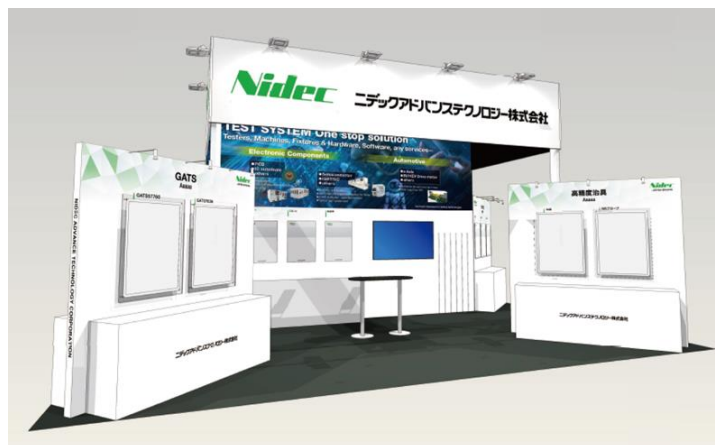
2024年6月6日

各位

会社名 ニデックアドバンステクノロジー株式会社
代表者名 代表取締役社長 山崎 秀和
所在地 京都府向日市森本町東ノ口1-1
ニデックパークC棟

JPCA Show 2024 出展について

ニデックアドバンステクノロジー株式会社（以下、当社）は、2024年6月12日(水)～6月14日(金)に東京ビッグサイトで開催される「第53回電子機器トータルソリューション展（JPCA Show 2024）」に出展します。



今回の展示会では、アドバンスドパッケージに対応した電気検査装置の最新モデル、HDI/プリント基板向けにブラッシュアップした電気検査装置や、それらに搭載する高速/高精度テストに加え、これまでにはなかった新発想ファインピッチ対応プローブ等のトータル電気検査ソリューションを提案します。また、EV/HE等の駆動モーター用テストベンチや、パワー半導体向けとしてIGBT/SiCの検査装置、微小バンプを2D/3D計測する光学式検査装置も併せて紹介致します。

これまで培ってきた検査技術をベースに、最新の検査ソリューションと未来に貢献する新製品・新技術を提案致します。当社は今後も、電子を読み時代を読むことを体現し実績を積み重ねて参ります。

〈出展概要〉

- ・会期：2024年6月12日(水)～6月14日(金)
- ・会場：東京ビッグサイト 東展示棟
- ・ブース：Hall4 4D-17

〈出展内容〉

- ・アドバンスドパッケージ対応導通/短絡検査装置「GATS77/78シリーズ」
- ・HDI/PCB基板向け導通/短絡検査装置「GATS/STAR RECシリーズ」
- ・高速/高精度検査テスト「R-5940」
- ・フラットケーブル対応導通/絶縁検査テスト「RZ-1207」
- ・高速/高精度マルチファンクションテスト「R-700シリーズ」
- ・高精度検査用治具
- ・狭ピッチ対応プローブ「NSプローブ」
- ・IGBT/SiCパワーモジュール検査装置「NATSシリーズ」
- ・xEVモーター用テストベンチ「TDASシリーズ」
- ・高密度基板対応光学式2D/3D検査装置「RSHシリーズ」
- ・ガラス基板対応3D計測装置「NSATシリーズ」